

## ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОВОЗБУЖДЕНИЯ И КИНЕТИКА ЭКСИТОНОВ

B.B. Травников, B.B. Криволапчук

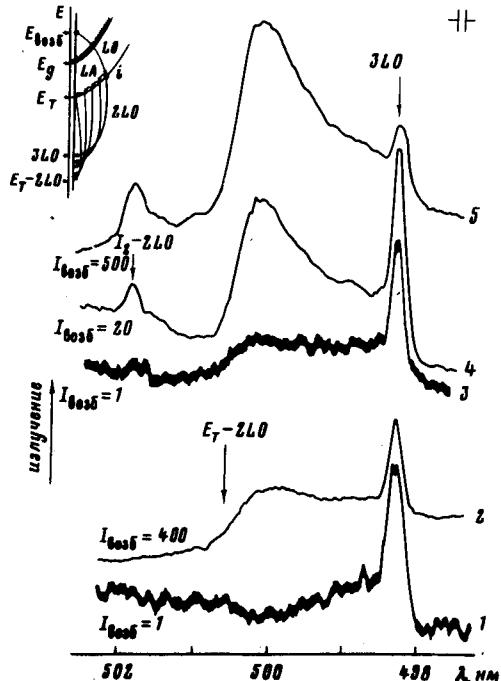
Впервые обнаружено влияние интенсивности возбуждающего света на кинетику установления стационарного распределения экситонов по энергии в зоне. Показано, что время жизни свободных экситонов увеличивается с ростом интенсивности возбуждения. Сделаны оценки изменения времени жизни.

Изменение интенсивности возбуждающего света ( $I_{\text{возб}}$ ) в области больших значений ( $> 10^3 \text{ Вт}/\text{см}^2$ ) широко используется при исследовании эффектов большой плотности, когда природа и кинетика явлений, возникающих в кристалле, в значительной степени определяются колективными свойствами экситонов. Оказывается, что и при "обычных"  $I_{\text{возб}}$ , когда концентрация экситонов мала, величина  $I_{\text{возб}}$  является фактором, существенно влияющим на свойства экситонов. В работе [1] было показано влияние  $I_{\text{возб}}$  на кинетику пространственного распределения экситонов по кристаллу. В данной работе впервые показано воздействие  $I_{\text{возб}}$  на кинетику установления энергетического распределения экситонов по зоне.

В работе исследованы кристаллы CdS, выращенные из газовой фазы. Эксперименты проводились при  $T = 2 \text{ К}$ . Возбуждение осуществлялось линией 476,5 нм аргонового лазера. Максимальная интенсивность возбуждающего света не превышала  $10^3 \text{ Вт}/\text{см}^2$ .

На рисунке представлены спектры излучения двух из исследованных в работе объемных образцов при различных значениях  $I_{\text{возб}}$ . Процессы, формирующие наблюдаемый спектр излучения, схематически представлены на вставке к рисунку [2]. Взбуждающий свет в результате рассеяния на  $LO$ -фононе создает экситоны в точке  $i$  экситонной зоны  $n = 1 \text{ А}$ . Последующее рассеяние экситонов на  $LA$ -фононах приводит к заселению других точек зоны. Представленные на рисунке спектры соответствуют излучению экситонов из разных точек зоны с отдачей в решетку энергии двух  $LO$ -фононов (в дальнейшем это излучение будем называть двухфононным). Линия  $3LO$  обусловлена двухфононным излучением экситонов из точки  $i$ . Стрелка  $E_T - 2LO$  указывает длинноволновую границу двухфононного излучения экситонов. Форма спектра двухфононного излучения, как известно [3], воспроизводит стационарное распределение экситонов по энергии в зоне. Рисунок демонстрирует существенную зависимость этого распределения от  $I_{\text{возб}}$ . Форма энергетического распределения экситонов по зоне зависит от числа актов рассеяния на  $LA$ -фононах, которые экситоны успевают совершить за время жизни в зоне  $\tau$ . Характер изменения распределения экситонов по зоне свидетельствует о том, что  $\tau$  с ростом  $I_{\text{возб}}$  увеличивается. В образце I при малой  $I_{\text{возб}}$  время жизни настолько мало, что экситоны успевают провзаимодействовать с очень небольшим

числом  $LA$ -фононов и высвечиваются, в основном, из точки  $i$  и ее ближайшей длинноволновой окрестности (спектр 1, рисунок). С увеличением  $I_{\text{возб}}$   $\tau$  возрастает, число актов рассеяния на  $LA$ -фононах увеличивается и при максимальной  $I_{\text{возб}}$  экситоны заселяют уже все точки зоны, причем большая часть экситонов находится ближе к дну зоны (спектр 2). При одинаковой интенсивности возбуждения форма распределения, а следовательно, и  $\tau$  в разных образцах отличаются [2]. Например, в образце 2 "начальное" время жизни при минимальной  $I_{\text{возб}}$  больше, чем в образце 1, и распределение экситонов по энергии (спектр 3) примерно такое же, как в образце 1 при большой  $I_{\text{возб}}$ .



Спектры двухфононного излучения экситонов в объемных образцах CdS при различных значениях интенсивности возбуждения ( $T = 2$  К). Значения  $I_{\text{возб}}$  указаны в произвольных единицах. Спектры 1, 2 соответствуют образцу 1, а спектры 3 – 5 – образцу 2. Линия  $I_2 - 2LO$  соответствует двухфононному излучению связанныго экситона  $I_2$ . На вставке:  $E_g$  – край собственного поглощения,  $E_g^*$  – энергия дна зоны экситонного состояния  $n = 1$  А,  $E_{\text{возб}}$  – энергия возбуждающего света

Полное время жизни экситонов в зоне определяется временами излучательной ( $\tau_R$ ) и безызлучательной ( $\tau_{nR}$ ) гибели экситонов:

$$1/\tau = 1/\tau_R + 1/\tau_{nR}. \quad (1)$$

Излучательное время характеризуется большими величинами порядка  $10^{-9} + 10^{-8}$  сек [4]. В исследованных объемных образцах вероятность безызлучательной гибели велика  $\tau_R \gg \tau_{nR}$  и поэтому  $\tau \approx \tau_{nR}$  [2]. Безызлучательное время определяется суммой вероятностей захвата экситонов ча различные типы центров:

$$1/\tau_{nR} = \sum_m \bar{\nu} \sigma_m N_m, \quad (2)$$

где  $\bar{\nu}$  – средняя скорость экситонов,  $\sigma_m$  и  $N_m$  – сечение захвата и число центров  $m$ -типа. При увеличении  $I_{\text{возб}}$  некоторая часть центров на-

чинаят насыщаться, концентрация их уменьшается, что и приводит, очевидно, к увеличению  $\tau$ . При разных значениях  $I_{\text{возб}}$  время жизни может определяться разными типами центров.

В наиболее совершенных (пластинчатых) образцах при всех использованных в данной работе  $I_{\text{возб}}$  двухфононное излучение имело равновесный характер. В этих образцах концентрация центров захвата гораздо меньше, чем в объемных и время жизни превышает время установления равновесия. Вместе с тем и в этом случае возможно изменение  $\tau$ , на что указывает рост длины диффузии экситонов с увеличением  $I_{\text{возб}}$ , наблюдаемый в некоторых из таких образцов при  $T = 77 \text{ K}$  [1]. Связано это с тем, что при малых  $I_{\text{возб}}$  время жизни хотя и больше времени установления равновесия, но все еще меньше  $\tau_R$ . Время  $\tau_R$  является, очевидно, верхней границей времени жизни экситонов в зоне.

Изменение времени в объемных образцах можно оценить, измерив отношение полной интегральной интенсивности полосы двухфононного излучения экситонов  $I_{\Sigma}$  к интенсивности  $3LO$  линии  $I_{3LO}$  [2]. Интенсивность  $I_{\Sigma}$  пропорциональна полному времени жизни экситона в зоне  $\tau$ , а  $I_{3LO}$  — времени жизни экситонов в точке  $i$  ( $1/\tau_i = 1/\tau_a + 1/\tau_{nR}$ , где  $\tau_a$  определяется временем ухода экситона из точки  $i$  в другие точки зоны за счет рассеяния на  $LA$ -фонах). Таким образом,

$$\frac{I_{\Sigma}}{I_{3LO}} = \frac{\tau}{\tau_i} = 1 + \frac{\tau_{nR}}{\tau_a}; \quad \text{или} \quad \frac{\tau}{\tau_a} = \frac{I_{\Sigma}}{I_{3LO}} - 1, \quad (3)$$

Используя значение  $\tau_a$ , полученное в работе [2], мы оценили времена жизни в исследованных образцах. Например, в образце 1 время жизни меняется от  $\sim 4 \cdot 10^{-12}$  сек при минимальной  $I_{\text{возб}}$  до  $\sim 1,3 \times 10^{-11}$  сек при максимальной  $I_{\text{возб}}$ , а в образце 2 — от  $\sim 1 \cdot 10^{-11}$  сек до  $\sim 6 \cdot 10^{-11}$  сек.

Таким образом, проведенные эксперименты показали существенное влияние  $I_{\text{возб}}$  на кинетические свойства экситонов. При использовании монохроматического возбуждающего света и соответствующем подборе образцов  $I_{\text{возб}}$  может быть использована как своеобразный инструмент воздействия, позволяющий при стационарных условиях возбуждения исследовать кинетические явления на разных стадиях развития во времени, вплоть до пикосекундного диапазона.

Описанные выше спектральные проявления влияния  $I_{\text{возб}}$  наблюдались нами и в кристаллах ZnSe при возбуждении линией 441,6 нм кадмиевого лазера. Очевидно, зависимость кинетики экситонов от  $I_{\text{возб}}$  характерна для всех кристаллов, в которых существенна роль безызлучательной гибели экситонов. В кристаллах с хорошо отработанной технологией и регулируемым составом дефектов исследование зависимости спектров излучения от  $I_{\text{возб}}$  может быть использовано для изучения природы безызлучательных переходов.

## Литература

- [ 1 ] Криволапчук В.В., Пермогоров С.А., Травников В.В. ФТТ, 1981, 23, 606.
  - [ 2 ] Пермогоров С.А., Травников В.В. ФТТ, 1980, 20, 2651.
  - [ 3 ] Гросс Е.Ф., Пермогоров С.А., Разбираин Б.С. ФТТ, 1966, 8, 1483.
  - [ 4 ] Toyozawa Y. Progr. Theor. Phys. (Kyoto) Suppl., 1959, 12, 111.
-